

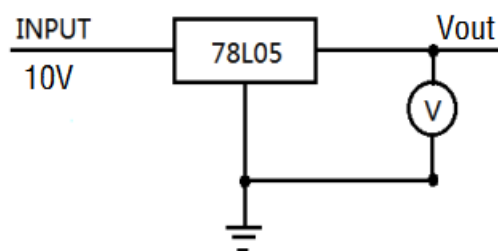
赛普半导体  
78L05 温度特性测试

测试时间：2020.07.25

---

测试芯片： 78L05    封装： TO-92

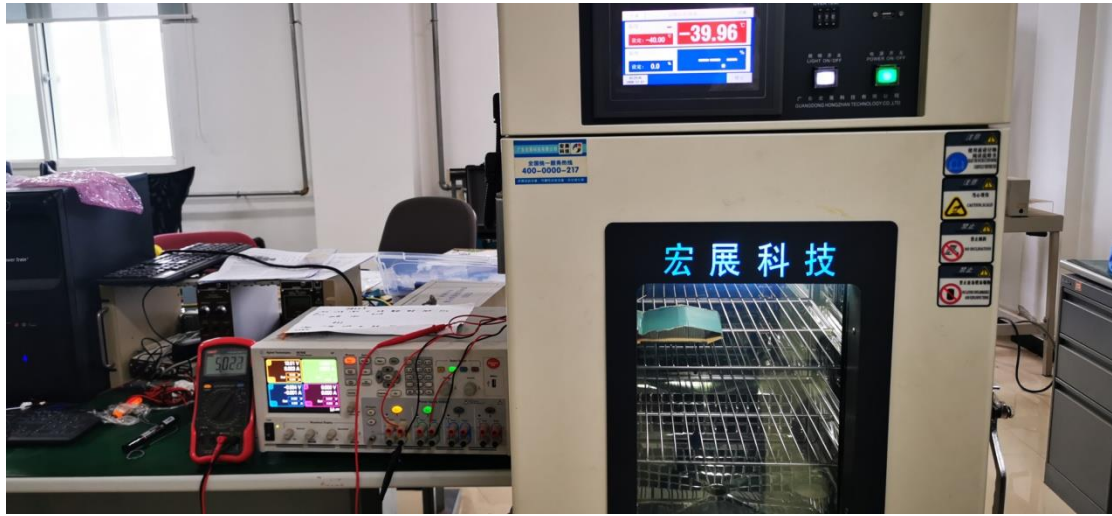
测试电路：



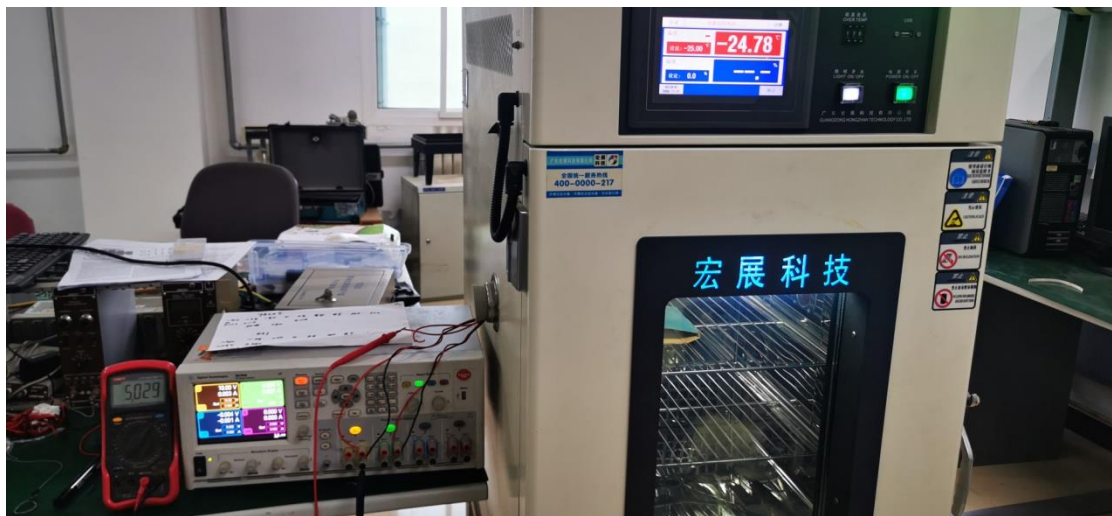
测试项目： 温度测试



$T_a = -40^{\circ}\text{C}$      $V_{REF} = 5.022\text{V}$     见下图



Ta = -25°C    VREF = 5.029V    见下图



Ta= 0°C    VREF= 5.038V    见下图



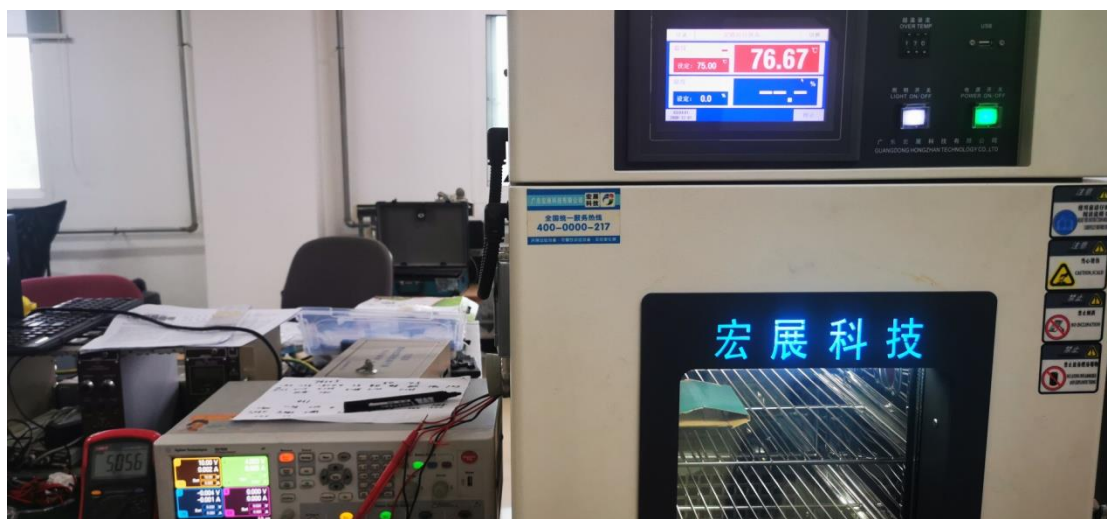
Ta= 25°C    VREF= 5.043V    见下图



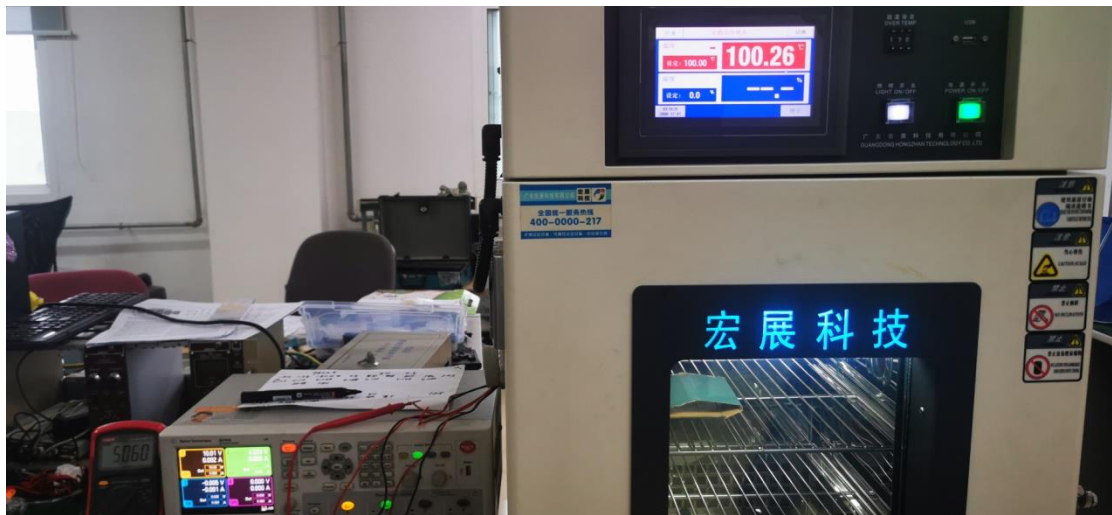
Ta= 50°C    VREF= 5.054V    见下图



Ta= 75°C    VREF=5.056V    见下图



Ta= 100°C    VREF= 5.060V    见下图



Ta= 125°C    VREF= 5.070V    见下图



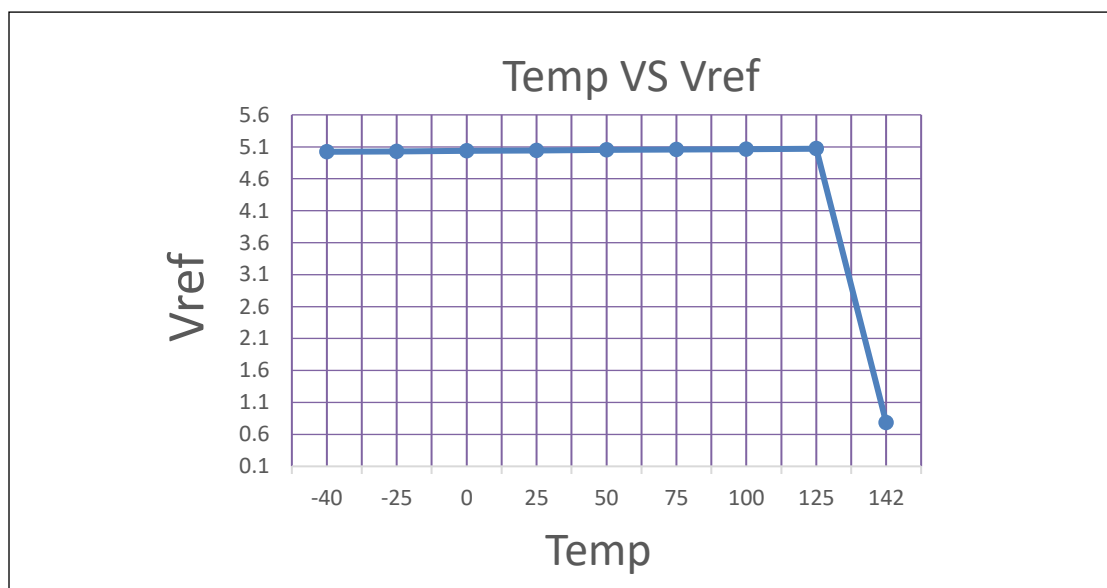
$T_a = 142^\circ\text{C}$     $V_{REF} = 0.786\text{V}$    见下图



温度特性汇总:



温度	VREF	温度	VREF	温度	VREF
-40℃	5.022V	25℃	5.043V	100℃	5.060V
-25℃	5.029V	50℃	5.054V	125℃	5.070V
0℃	5.038V	75℃	5.056V	142℃	0.786V



$$\Delta V_{\text{OUT}}/\Delta T = 0.29\text{mV}/^{\circ}\text{C}$$

芯片温度保护点：142℃